پیش گزارش آزمایش ۲ آز مدار منطقی

علی دهقانی ، ماهان بیهقی دانشگاه صنعتی شریف

نام آزمایش

مشخصه گیت NAND و آشنایی با مفهوم ت

اهداف آزمایش

آشنایی با مفهوم مشخصه انتقالی در مدارهای الکتریکی و پدیده Fan-out در تراشه های TTL

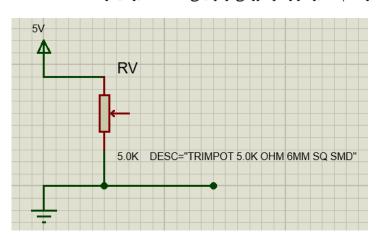
شرح آزمایش

لیست تراشه ها و قطعات مورد نیاز

تراشه ۵۰۰ DM۷۴LS ، منبع تغذیه ۵ ولت DC ، مقاومت ۱ کیلواهم ، مقاومت ۳۰۰ اهم ، اسیلوسکوپ ، پتانسیومتر

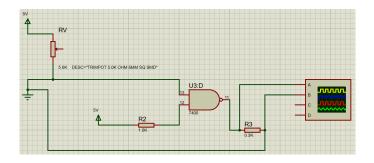
مراحل آزمایش و مدارات

 ابتدا یک منبع تغذیه متغیر میسازیم. برای اینکار از منبع تغذیه موجود ۵ ولت و پتانسیومتر استفاده میکنیم. یک سر پتانسیومتر به زمین و سر دیگر به منبع dc متصل است. با تغییر دادن مقاومت پتانسیومتر ولتاژ خروجی از نزدیکی ∘ تا ۵ متغیر میشود.



شكل ١: منبع متغير

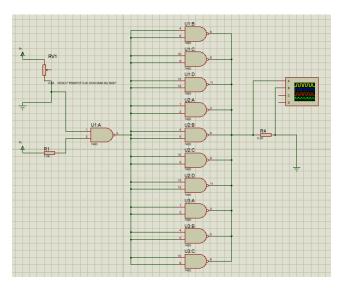
- یکی از پایه های تراشه °۷۴۰ به منبع متغیر و سر دیگر را همانند شکل مدار زیر به منبع ۵ ولت با مقاومت ۱ کیلواهم بر سر راه آن وصل میکنیم.
- برای اندازه گیری ولتاژ خروجی با قرار دادن یک مقاومت ۳۰۰ اهمی در مدار و اتصال به دو سر اسلیوسکوپ ، جریان و ولتاژ خروجی را اندازه میگیریم. با تغییر دادن مقاومت پتانسیومتر از ۰



شکل ۲: مدار اندازه گیری مشخصه انتقالی

تا حداکثر مقدار ممکن ولتاژ خروجی منبع متغیر را از ۵ تا نزدیکی \circ تغییر میدهیم و با استفاده از مقادیر نشان داده شده توسط اسیلوسکوپ \circ نمودار \circ Vo - Vi را رسم میکنیم.

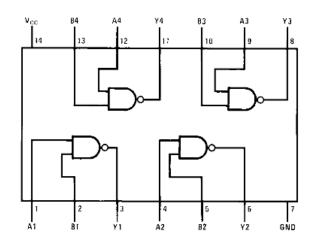
- حال با تغییر دادن مقاومت پتانسیومتر از مقدار بسیار زیاد حداکثر آن به صفر ، ولتاژ منبع متغیر
 را از ۰ تا ۵ تغییر میدهیم و به طور مشابه نمودار Vo Vi را رسم میکنیم.
- در مرحله بعد آزمایش خروجی گیت NAND را به ورودی های ۱۰ گیت مشابه متصل میکنیم
 و با تکرار مراحل قبل مجددا نمودار Vo Vi



شكل ٣: مدار مرحله آخر آزمايش

خلاصه جداول دیتاشیت تراشه های مورد استفاده

جداول زير از اين منبع اتخاذ شده اند:



شکل ۴: دیاگرام اتصالات تراشه ۲۴۰۰

 $Y = \overline{AB}$

Inputs		Output
Α	В	Y
L	L	Н
L	Н	Н
Н	L	н
Н	Н	L

H = HIGH Logic Level L = LOW Logic Level

شکل ۵: جدول عملکردی تراشه ۲۴۰۰